Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/683,570	OGUSHI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Kidest Bahta	2125	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
705-	16,23	3/06	Q
700	100,10		
	103)	
	109		
	106		
	F 11		
	વ6.		
707	1,10		
	100,109		}
			(8)

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		-		
		•		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)					
	DATE	EXMR			
<u> </u>					
,	•				
•					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
•					
•					
· 	ļ				
· ·					
		 - -			